

04; 10

© 1991 г.

## ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИОННО-ПУЧКОВОЙ ПЛАЗМЫ В ПРОСТРАНСТВЕ ДРЕЙФА С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

*A. A. Goncharov, A. V. Zatlyagan, I. M. Protsenko*

Исследуется динамика усиления газовой компенсации интенсивного ионного пучка при введении положительного потенциала в пространство дрейфа последнего. Установлено, что имеются два характерных этапа в эволюции ионно-пучковой плазмы. Наличие этих этапов проявляется в двухступенчатой форме импульсов плотности тока пучка, сигналов емкостного зонда и др. Сравнительные величины ступенек нетривиально зависят от физических параметров системы и ее предыстории. Показано также, что мгновенные радиальные распределения медленных ионов оказываются немонотонными с абсолютным максимумом, смещающимся с ростом давления к периферии, а зондовые характеристики существенно деформируются из-за присутствия быстрых пространственно-изотропизированных электронов вторичной эмиссии. Предложены соображения о физических механизмах наблюдаемых явлений и количественные оценки, качественно объясняющие экспериментальные результаты.

### Введение

В процессе компенсации объемного заряда интенсивного пучка положительных ионов могут использоваться электроны, генерируемые самим пучком как в результате ударной ионизации остаточного газа, так и электроны вторичной ионно-электронной эмиссии [1]. Создавая благоприятные условия для увеличения времени удержания вторичных электронов в объеме пучка можно резко повысить темп газовой компенсации. Этого, в частности, можно добиться введением положительного потенциала в пространство дрейфа пучка. Как было показано в [2], наличие положительного потенциала в пространстве дрейфа, ограниченном заземленными стенками, приводит при низких давлениях к резкому уменьшению радиального электрического поля в пучке и существенному улучшению его транспортировки из-за развития несамостоятельного газового разряда.

Дальнейшее исследование временной динамики процесса формирования ионного пучка и эволюции плазменной среды, обусловленных дополнительной ионизацией остаточного газа вторичными электронами, выявило два характерных этапа эволюции ионно-пучковой плазмы. Длительность первого могла достигать в зависимости от экспериментальных условий  $\sim 50$  мкс и определялась резким возрастанием времени удержания быстрых вторичных электронов в системе при подаче положительного потенциала. Второй связан с процессами накопления медленных заряженных частиц из-за ионизационных актов, вытеснения электрического поля в пристеночные слои и привязки потенциала пространства к вводимому потенциалу [3]. В настоящей работе приводятся результаты детального исследования динамики формирования ионного пучка и развития газового разряда, а также соображения о физических механизмах наблюдаемых явлений.

### Экспериментальная установка и методика измерений

Экспериментальные исследования проводились на установке, схематически представленной на рис. 1. Модифицированный ионный источник 1 типа «обращенный газомагнетрон» с двумя накаливаемыми вольфрамовыми витками на ди-

электрических торцах позволял инжектировать в дрейфовое пространство длиной  $L \sim 20-30$  см пучок ионов водорода с начальным диаметром 1.5 см, энергией  $\varepsilon_i \leq 40$  кэВ и током  $I_i \leq 1.2$  А при длительности импульса  $\tau_i \sim 100$  мкс. В режиме без магнитного поля, создаваемого током по катодному блоку, но с накаленными витками ионный источник мог обеспечить получение малошумящего пучка с током  $I_i \leq 0.1$  А, используемого для контрольных экспериментов. Длина пучка ограничивалась секционированным коллектором 7, совмещенный с электростатическим анализатором 8, позволяющим измерять ток приосевых

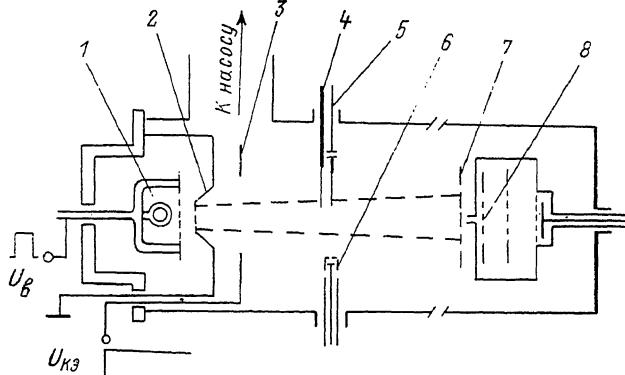


Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

1 — ионный источник, 2 — экстрактор, 3 — кольцевой электрод, 4 — ленгмюровский зонд, 5 — емкостный зонд, 6 — зонд-анализатор, 7 — секционированный коллектор, 8 — электростатический анализатор.

частиц пучка. На помещаемый коаксиально с пучком в дрейфовой камере кольцевой электрод 3, площадь  $S_A$  и средний диаметр  $d$  которого варьировались в пределах  $S_A \sim 8-140$  см<sup>2</sup>,  $d \sim 0-11$  см, подавалось ступенчатое напряжение  $U_{ka}(t)$  (рис. 1) с фронтом нарастания  $\sim 1.5$  мкс, временем экспоненциального спада  $\sim 300$  мкс и максимальной амплитудой  $\sim 2$  кВ. Момент подачи  $U_{ka}(t)$  мог регулироваться в широком интервале времени, перекрывающем длительность импульса пучка. Для измерения параметров пучка и плазменной среды использовались подвижные цилиндрические и плоские ленгмюровские зонды 4, 5, а также миниатюрный, экранированный от быстрых частиц пучка зонд-анализатор 6 с варьируемым потенциалом экранирующей сетки. Давление остаточного газа в камере поддерживалось в пределах  $p \sim 5 \cdot 10^{-4}-1 \cdot 10^{-2}$  Па.

### Экспериментальные результаты

Основными изменяемыми параметрами в эксперименте были амплитуда и момент приложения импульса  $U_{ka}$ , давление  $p$ , площадь  $S_A$ , полный ток пучка  $I_i$  и его энергия  $\varepsilon_i$ . Эксперименты выявили два характерных этапа в эволюции ионно-пучковой плазмы при подаче  $U_{ka}$ . Первый определяется интервалом времени, когда в процессе выравнивания потенциала пространства в среде и привязки к потенциальному кольцевого электрода преобладает роль вторичных электронов с коллектора. Второй связан с процессом накопления медленных заряженных частиц за счет ионизации с участием быстрых электронов и пучка, определяющим дальнейшую эволюцию потенциала пространства к вводимому потенциальному. Наличие этих двух этапов проявляется в характерной двухступенчатой форме импульсов плотности тока пучка, сигнала емкостного зонда, тока на кольцевой электрод и др. На рис. 2 представлен ряд осциллографм импульса тока ионного пучка  $I_{ia}$  на коллектор электростатического анализатора, демонстрирующих эволюцию формы и величины тока пучка в функции давления при наложении импульса  $U_{ka}$  в начальной фазе развития пучка (стрелкой указан момент подачи  $U_{ka}$ ). Характерная особенность осциллографм, отчетливо видная на рис. 2, б, в, — наличие двух выраженных ступенек роста плотности тока пучка. С увеличением давления (рис. 2, г), а также при сдвиге времени подачи  $U_{ka}$  к концу импульса пучка (рис. 2, д) такая двуступенчатость не наблюдается.

Эта же закономерность проявляется и на осциллографмах тока пучка на центральном электроде секционированного коллектора. Прикладывая импульс  $U_{\text{кз}}$  примерно на половине длительности импульса пучка и сопоставляя величины ступенек, можно оценить степень усиления газовой компенсации в зависимости от различных параметров. На рис. 3 приведена зависимость тока  $I_{\text{аll}}$  от полного тока  $I_B$ . Как следует из рис. 3, а, существует некоторый критический ток пучка, выше которого эффект положителен и с ростом последнего быстро увеличивается. Отметим также, что оптимум усиления газовой компенсации в функции  $U_{\text{кз}}$ , обнаруженный в [2], с ростом  $I_B$  в типичных условиях эксперимента смещается в сторону больших  $U_{\text{кз}}$ . На рис. 4 представлена зависимость  $I_{\text{all}}$  от давления

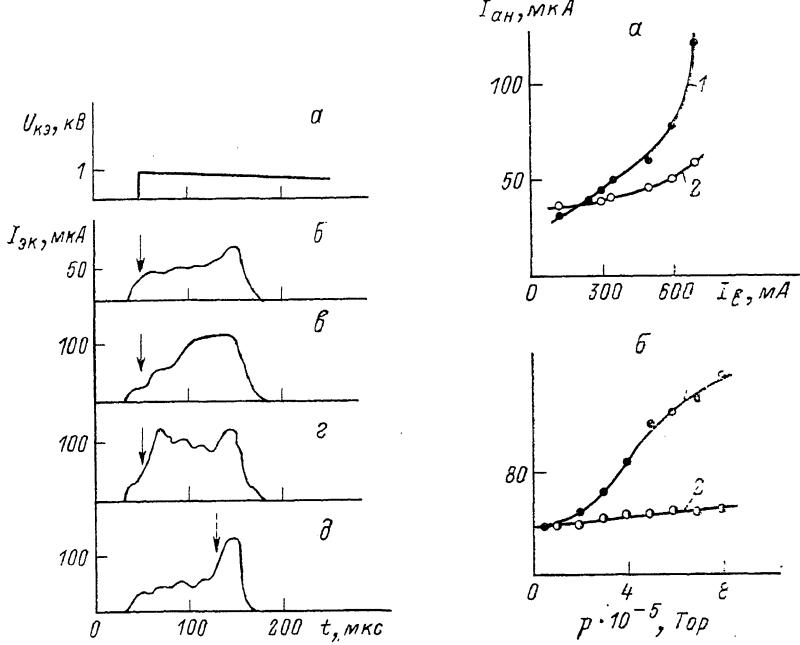


Рис. 2. Типичные осциллографмы тока ионного пучка на электростатический анализатор.  $S_A = 8 \text{ см}^2$ ,  $I_B = 0.55 \text{ A}$ ,  $\epsilon_B = 30 \text{ кВ}$ ; а — импульс напряжения на кольцевом электроде, б —  $p = 4 \cdot 10^{-3}$ , в —  $1 \cdot 10^{-2}$ , г —  $5 \cdot 10^{-3}$  Па.

Рис. 3. Зависимости осевого тока ионного пучка от полного тока (а) и от давления в камере дрейфа (б).

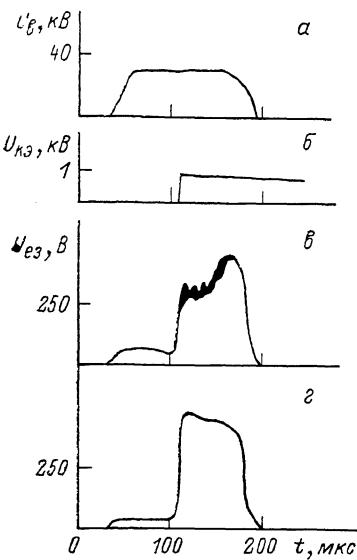
а:  $p = 4 \cdot 10^{-2}$  Па,  $\epsilon_B = 30 \text{ кВ}$ ,  $S_A = 20 \text{ см}^2$ ;  $U_{\text{кз}}, \text{ кВ}$ : 1 — 1, 2 — 0; б:  $S_A = 20 \text{ см}^2$ ,  $I_B = 0.55 \text{ A}$ ,  $\epsilon_B = 30 \text{ кВ}$ ;  $U_{\text{кз}}, \text{ В}$ : 1 — 600, 2 — 0.

ления в камере дрейфа. Следует отметить наличие характерного излома кривой 1 (рис. 3, б), наблюдаемого в области  $p \sim 3-7 \cdot 10^{-3}$  Па при различных значениях  $S_A$ ,  $I_B$ ,  $U_{\text{кз}}$ . Аналогичный излом, наблюдаемый на кривой зависимости тока кольцевого электрода от  $p$ , коррелирует с изломом кривой 1.

Наличие ленгмюровского и емкостного зондов обеспечивало в условиях эксперимента точную фиксацию локальных и временных вариаций плавающего потенциала пространства развивающейся ионно-пучковой плазмы. Типичные осциллографмы импульсов емкостного зонда при двух значениях давления  $p$  представлены на рис. 4. Как видим из рис. 4, в, и в этом случае четко наблюдается двухступенчатая форма импульса  $U_{\text{вз}}$ . Сравнительные величины имеющихся ступенек и их длительности нетривиально зависят от физических параметров системы ( $p$ ,  $U_{\text{кз}}$ ,  $I_B$ ,  $S_A$ ,  $\epsilon_B$ ) и предыстории ее развития. Так, в сходных условиях эксперимента потенциал второй ступени при малом  $S_A = 8 \text{ см}^2$  отстает от первой, в области средних  $S_A = 40-80 \text{ см}^2$  превосходит ее, а при  $S_A = 140 \text{ см}^2$  разница между ними практически нивелируется. Интересно проследить процесс вытеснения электрического поля из объема пучка. На рис. 5 представлены радиальные распределения  $U_{\text{вз}}$ , полученные для двух разных моментов времени.

Кривая 2 отвечает времени, соответствующему середине первой ступени, а кривая 1 — середине второй. Видно, как по мере накопления медленных заряженных частиц и развития плазменной среды происходит выравнивание потенциала и электрическое поле вытесняется из пучка (при  $r=2$  см плотность тока пучка уменьшается почти на порядок).

Были проведены измерения динамики образования медленных ионов с помощью экранированного зонда-анализатора. Если в развитой ионно-пучковой плазме, когда  $U_{\text{кв}}=0$ , мгновенные (усредненные за 5 мкс) радиальные распределения медленных ионов имеют вид кривой с максимумом при  $r=0$ , то при на-



личии достаточно большого  $U_{\text{кв}}$ , такое распределение становится существенно немонотонным с абсолютным максимумом, смещающимся к периферии системы (рис. 6, а). Представленные на рис. 6, б зависимости потока медленных ионов на коллектор зонда-анализатора в функции  $r$  свидетельствуют, что процессы

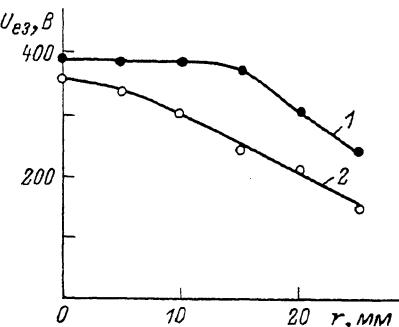


Рис. 4. Осциллограммы сигналов емкостного зонда для разных давлений.

$S_A = 25 \text{ см}^2$ ,  $I_B = 0.65 \text{ А}$ ; а — импульс высокого напряжения на экстракторе, б — импульс  $U_{\text{кв}}$ , в —  $p = 1.1 \cdot 10^{-8}$ , г —  $6.7 \cdot 10^{-8}$  Па.

Рис. 5. Радиальное распределение плавающего потенциала для разных моментов времени.

$S_A = 25 \text{ см}^2$ ,  $I_B = 0.64 \text{ А}$ ,  $\epsilon_B = 30 \text{ кВ}$ ,  $p = 6.7 \cdot 10^{-4}$  Па.

образования ионов на оси системы ( $r=0$ ) и на периферии ( $r=6$  см) существенно различаются. Как видим, кривая максимального тока ионов при  $r=6$  см является нелинейной и имеет характерный излом в области тех же  $p \sim 3-7 \times 10^{-3}$  Па.

И, наконец, заметим, что проведенные в работе серии мгновенных (за 5 мкс) зондовых измерений как с помощью ленгмюровских плоских и цилиндрических зондов, так и с помощью экранированного зонда с варьируемым потенциалом экранирующей сетки позволили установить наличие характерного максимума на ионной ветви зондовой характеристики, четко проявляющегося при достаточно высоком потенциале пространства в системе (рис. 7, а, б).

### Обсуждение экспериментальных результатов

Совокупность представленных экспериментальных данных можно качественно объяснить, предположив следующее.

1. Введение положительного потенциала в пространство дрейфа ионного пучка оказывается эффективным, когда величина этого потенциала меньше потенциала нескомпенсированного пучка.

2. Образуемые ионным пучком на коллекторе вторичные электроны, выбираваемые медленными ионами с поверхности камеры объемом  $V$ , осциллируют во всех направлениях до попадания на кольцевой электрод. По аналогии с полым катодом [4] среднюю длину пробега таких электронов можно представить в виде  $l=4V/S_A$ .

3. Скорость установления стационарного состояния газового разряда и его характер определяются степенью развития ионно-пучковой плазмы и величиной  $S_A$ . Деформации ионной части зондовых характеристик естественно объясняются тем, что быстрые пространственно-изотропизированные электроны имеют коэффициент вторичной электрон-электронной эмиссии больше единицы. Так что такие экспериментальные факты однозначно указывают на присутствие группы быстрых электронов в системе.

Равновесные концентрации различных компонент заряженных частиц можно оценить, исходя из упрощенных представлений об их кинетике. Полагаем, что быстрые первичные электроны выбиваются ионным пучком с коллектора пло-

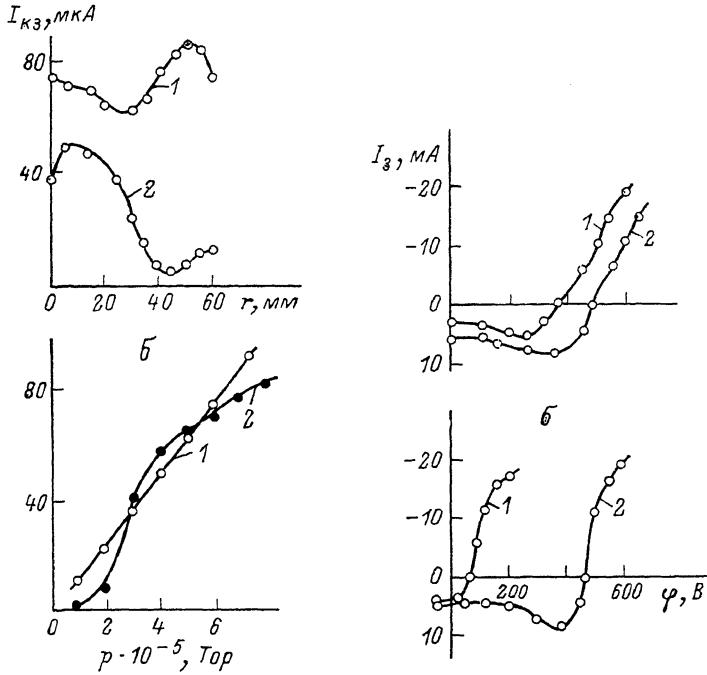


Рис. 6. Радиальное распределение медленных ионов (а) и зависимость тока медленных ионов от давления (б).

а:  $I_B = 0.6$  А;  $S_A = 100$  см<sup>2</sup>;  $U_{K3} = 600$  В;  $p$ , Па; 1 —  $4.5 \cdot 10^{-3}$ , 2 —  $2 \cdot 10^{-3}$ ; б:  $I_B = 0.6$  А;  $\epsilon_B = 30$  кэВ;  $U_{K3} = 600$  В;  $r$ , см; 1 — 0, 2 — 6.

Рис. 7. Типичные характеристики цилиндрического зонда.

С:  $S_A = 140$  см<sup>2</sup>;  $I_B = 0.55$  А;  $p = 6.6 \cdot 10^{-4}$  Па;  $U_{K3}$ , В: 1 — 0, 2 — 600;  $r$ , см: а — 0, б — 3.5.

щадью  $S_k$  и уходят из объема полости  $V$  через некоторое среднее время жизни  $\tau_e$ . Тогда

$$\gamma_i j_B S_k = (n_e / \tau_e) V, \quad (1)$$

где  $\tau_e = l / \langle v_e \rangle$ ;  $\langle v_e \rangle$  — средняя скорость осциллирующих электронов, зависящая от потенциала  $U_{K3}$ ;  $\gamma_i$  — коэффициент ионно-электронной эмиссии быстрых частиц пучка.

Уравнение кинетики медленных электронов при достаточно большом давлении можно представить в следующем виде:

$$V (dn_{eM} / dt) = n_e \langle v_e \rangle n_a \sigma_e V + n_b n_a \gamma_i v_b V_1 - (n_{eM} / \tau_{eT}) V. \quad (2)$$

Здесь  $\tau_{eM} = \beta L / v_{eT}$ ,  $v_{eT}$  — тепловая скорость электронов,  $\beta$  — геометрический фактор порядка единицы,  $V_1$  и  $v_b$  — объем и скорость пучка,  $n_a$  — концентрация нейтральных атомов газа.

Из (2) с учетом (1) получаем в стационаре

$$n_{eM} = \beta \frac{I_e n_a \sigma_e L}{\pi R^2 e v_{esT}} (4 \gamma_i \sigma_e \pi R^2 / \sigma_i S_A + 1). \quad (3)$$

Аналогично для  $n_{iM}$  с учетом  $\tau_{iM} = \beta_1 R / v_{is}$ , где  $R$  — радиус полости (полагаем  $L \gg R$ ),  $v_{is}$  — скорость ухода медленных ионов из объема плазмы порядка скорости неизотермического звука, получим

$$n_{iM} = \beta_1 \frac{I_e n_a \Sigma \sigma_i}{e v_{is} \pi R} (4 \gamma_i \sigma_e \pi R^2 / \Sigma \sigma_i S_A + 1). \quad (4)$$

Здесь  $\Sigma \sigma_i = \sigma_i + \sigma_{ne}$ . В реальных условиях эксперимента выражения в скобках (3) и (4) могут в 10—50 раз превосходить единицу, определяя тем самым степень усиления газовой компенсации осциллирующими вторичными электронами. Поток медленных ионов на стенки камеры выбивает вторичные электроны с коэффициентом  $\gamma'_i$ . Дополнительное количество медленных ионов, образуемых этими электронами в объеме, равно

$$n'_{iM} = \beta_1 \frac{4 \gamma'_i S n_a \sigma_e R}{S_A} n_{iM}, \quad (5)$$

где  $S$  — поверхность полости камеры.

Сопоставляя (4) и (5), видим, что концентрация дополнительных ионов растет с  $n_a$  нелинейно. При  $n'_{iM} \geq n_{iM}$  начинает выполняться условие самовоспроизведения ионов, ускоренных в пристеночных слоях, и высоковольтный тлеющий разряд переходит в самостоятельный. Это произойдет при

$$\beta_1 \frac{4 \gamma'_i S n_a \sigma_e R}{S_A} \geq 1.$$

Для типичных условий  $L=30$  см,  $R=12$  см,  $S_A=25$  см<sup>2</sup>,  $\gamma'_i \sim 0.1$ ,  $\sigma_e \sim 3.2 \cdot 10^{-16}$  см<sup>2</sup> критическое значение  $n_a=5 \cdot 10^{12}$  см<sup>-3</sup>, что отвечает давлению  $p \approx 2.7 \cdot 10^{-2}$  Па и качественно согласуется с экспериментальными данными. Отметим также, что максимальные плотности радиального тока медленных ионов достигали в эксперименте нескольких мА/см<sup>2</sup>.

#### Список литературы

- [1] Габович М. Д. // УФН. 1977. Т. 55. № 2. С. 259—284.
- [2] Гончаров А. А., Проценко И. М., Самков М. П. // ЖТФ. 1986. Т. 56. Вып. 5. С. 931—935.
- [3] Гончаров А. А., Затягай А. В., Проценко И. М. // Тез. докл. VII Всесоюз. конф. по плазменным ускорителям и ионным инжекторам. Харьков, 1989. С. 149—150.
- [4] Метель А. С. // ЖТФ. 1985. Т. 54. Вып. 2. С. 241—247.

Институт физики АН УССР  
Киев

Поступило в Редакцию  
3 декабря 1990 г.